

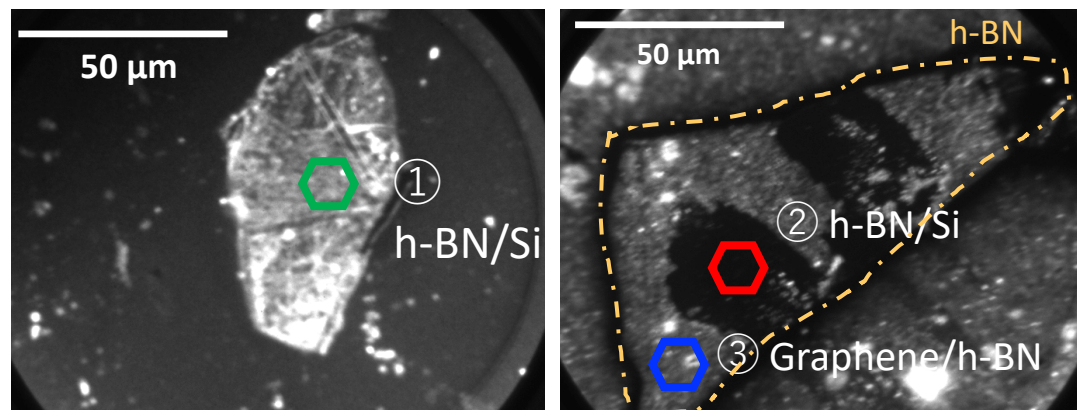
光電子顕微鏡による微小結晶界面の電子状態評価

(東北大多元研) 小川修一、虻川匡司、高桑雄二
(産業技術総合研究所) 山田貴壽

フルペーパーを掲載する応用物理系の雑誌の中で、
世界最高峰のIFを持つ影響力の大きな専門誌である。

Band alignment determination of bulk *h*-BN and graphene/*h*-BN laminates using photoelectron emission microscopy

Shuichi Ogawa, Takatoshi Yamada, Ryo. Kadowaki, Takashi Taniguchi, Tadashi Abukawa, and Yuji Takakuwa



Photoelectron emission microscopic images of hexagonal boron nitride (*h*-BN) and graphene covered *h*-BN single crystal.

光電子顕微鏡を用いて粒径数十 μm の六方晶系窒化ホウ素 (*h*-BN) 単結晶とグラフェンの積層物の光電子スペクトルを測定し、グラフェン積層による*h*-BNのバンド構造変化を明らかにしました。

The photoelectron spectra of stack of graphene/*h*-BN with a particle size of several tens of μm was measured using the photoelectron emission microscopy to reveal the change in band structure due to the stack.